

近接電磁界イミュニティ試験の概要

携帯通信端末や RFID の普及に伴い、各種電子機器は近傍の波源から発生した電磁界にさらされる場面が増えていますが、これらの状況を模擬したイミュニティ試験は従前の放射イミュニティ試験では適さないことから、近接した波源からの放射界に対するイミュニティ試験規格として IEC61000-4-39 が 2017 年に発行されました。さらに医療機器に関しては、JIS T 0601-1-2:2023 において、この規格に準拠した近接磁界イミュニティ試験要求が加えられるなど、近接電磁界イミュニティ試験の重要性は増しています。

本講習では、IEC61000-4-39 に準拠した近接電磁界イミュニティ試験の概要を座学形式で学習します。

- 日 時 : 令和7年 2月 25日(火) 13:30~15:00
- 開催場所 : 山梨県産業技術センター 甲府技術支援センター
イノベーション支援棟 2階 イノベーションルーム 2
(甲府市大津町2094)
- 講 師 : やまだ かずのり 山田 和謙 氏
(株式会社テクノサイエンスジャパン 代表取締役社長)
- 受講料 : 無料

お申し込みは、電子メールもしくはFAXにてお願いいたします。

電子・システム技術部 電子応用科 木島、萩原、中村、富永、小西
FAX:055-243-6110 TEL:055-243-6111
E-Mail:yitc-kit02@pref.yamanashi.lg.jp

電子応用技術セミナーⅢ 「近接電磁界イミュニティ試験の概要」
参加申込書

企業名		氏名	
連絡先	所在地	TEL	
メールアドレス			
名簿への記載可否(○か×)			

* 講師に参加者の「氏名」、「企業名」を記載した名簿を渡します。講師用名簿への記載の可否を「記載可否」欄に○×でご記入ください。
* 頂いた情報は本セミナーの運営にのみ使用し、適切に取り扱います。